

INFORMAȚII PERSONALE

Vasile Eugeniu



📍 Str. Nada Florilor, nr. 2, București, 023603, România

☎ (+40) 722 272 814

✉ eugeniuvasile@yahoo.com

🌐 www.researchgate.net/profile/E_Vasile

Sexul Masculin | Data nașterii 07/11/1955 | Naționalitatea Română

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mai 2013 - Prezent

Cercetător științific gradul I – CS I, Doctor în fizică

Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor, Str. Polizu nr. 1-7, București, 011061, România

- Analiză micro și nanostructurală în știința materialelor prin difracție de raze X (XRD), Microscopie electronică de baleiaj (SEM), Microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM), Spectrometrie de raze X dispersivă în energie (EDXS), Spectrometrie de pierdere de energie a electronilor (EELS) pentru proiecte de cercetare naționale

Tipul sau sectorul de activitate Educație și Cercetare

Aprilie 2004 – Mai 2013

Cercetător științific gradul I – CS I, Doctor în fizică, Conducătorul Laboratorului de Microscopie Electronică a Metav CD

SC METAV – CERCETARE DEZVOLTARE SA, Str. C.A. Rosetti, nr. 31, București, sector 2, România

- Analiză micro și nanostructurală în știința materialelor prin difracție de raze X (XRD), Microscopie electronică de baleiaj (SEM), Microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM), Spectrometrie de raze X dispersivă în energie (EDXS), Spectrometrie de pierdere de energie a electronilor (EELS), pentru proiecte de cercetare naționale și europene în următoarele domenii: energie, sănătate, mediul înconjurător, științe inginerești;
- Coordonator științific și membru de echipă în multe proiecte de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul științei materialelor

Septembrie 1980 – Aprilie 2004

Inginer, Cercetător științific gradul I, Doctor în fizică, Conducătorul Laboratorului de Microscopie Electronică a Metav SA

SC METAV SA, Str. Biharia, nr. 1, București, România

- Analiză micro și nanostructurală în știința materialelor prin difracție de raze X (XRD), Microscopie electronică de baleiaj (SEM), Microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM), Spectrometrie de raze X dispersivă în energie (EDXS), pentru proiecte de cercetare naționale și europene în domeniile aeronautic și nuclear;
- Director de proiect, coordonator științific și membru de echipă în multe proiecte de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate Producție de piese turnate, piese forjate și componente pentru industria aeronautică și cercetare în domeniul materialelor pentru aviație.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

08-10 Martie 2016

Training pentru Titan Themis 200 (aplicații în Științele Vieții)

Instruire efectuată de către FEI Company prin reprezentantul Marteen Wirix (cercetător științific în cadrul FEI Company), desfășurată la Universitatea Politehnică din București

Subiecte acoperite: pregătirea probelor pentru CryoTEM și imagistică de bază, imagistică și aliniere STEM/EDS, tomografie

- 16 – 18 Februarie 2016 **Training pentru Titan Themis 200 (aplicații în Știința Materialelor)**
 Instruire efectuată de către FEI Company prin reprezentantul Sorin Lazăr (cercetător științific senior în cadrul FEI Company), desfășurată la Universitatea Politehnica din București
- Subiecte acoperite: microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM), realizarea corecției imaginii, microscopie electronică prin transmisie cu scanare de înaltă rezoluție (HR STEM), sistemul optic de condensoare, spectroscopie dispersivă în energie (EDX), EELS, Velox, achiziție de imagini cu ajutorul modului Lorentz, achiziții de hărți în STEM, EDX și EELS.
- 08 -12 Februarie 2016 **Training pentru aplicații Versa 3D (SEM, FIB, EDS)**
 Instruire efectuată de către FEI Company prin reprezentantul Ellen Baken (specialist în aplicații FEI Company), în cadrul Universității Politehnica din București
- Cursul a acoperit principiile fundamentale și aspectele practice ale microscopului electronic cu baleiaj (SEM) Versa 3D, cum ar fi: punerea și scoaterea probelor din microscop, formarea unei imagini SEM, utilizarea detectorilor, navigarea cu ajutorul stage-ului, alinierea fascicului și realizarea unui secțiuni transversale.
- Subiecte acoperite: noțiuni despre instrument (introducere la interfața grafică, navigarea cu ajutorul stage-ului), despre fascicul de electroni (tipuri de interacții și semnale rezultante) și despre fascicul de ioni (operare generală), pregătirea probelor pentru microscopie electronică prin transmisie (TEM), spectroscopie dispersivă în energia radiației X (EDS) și semnale rezultante.
- 2-6 Martie 2009 **Certificat pentru Difractometrie de raze X**
 Panalytical Company, Center Laboratory, Almelo, Olanda
- Curs de noțiuni de bază de difracție
- Noiembrie 2008 **Certificat pentru Microscopie electronică prin transmisie**
 FEI Company, Eindhoven, Olanda
- Curs Tecnai de bază
- Februarie 1992 – Iulie 1999 **Diplomă de Doctor**
 Institutul de Fizică Atomică, București
- Fizică-Spectroscopie
- 1975 - 1980 **Diplomă de Inginer**
 Facultatea de Fizică, Universitatea din București
- Fizică

COMPETENTE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute

	INTELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citare	Participare la conversație	Discurs oral	
Engleză	B1	B2	B2	B2	B2
Franceză	A2	B2	A2	A2	B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
 Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Scriți competențele de comunicare deținute. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

- bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager de vânzări

Competențe
organizaționale/manageriale

- leadership (responsabil pentru echipe formate din 5-6 persoane in proiecte de cercetare)

Alte competențe

- MS Office (Word, Excel, Power Point)

Permis de conducere

Categoria B